

講演会のお知らせ

佐賀大学教職員各位、西九州化学工学懇話会会員各位

以下のように講演会を開催します。

講師は九州シンクロトロン光研究センターに所属されており、XAFS などを用いて元素選択的に化学状態や配位環境に関する知見を得る研究を行っています。取りまとめである川喜田の学生時代の友人でもあります。今回、ご自身の研究内容についてご講演いただきます。講演会是对面のみとさせていただきます。お時間のある方はご参加いただければと存じます。なお、受付も実施せず、懇親会も行いません。

日時：2023年12月8日（金）16:20-18:00

場所：理工学部8号館5F 国際環境セミナー室

講演題目：SAGA-LSにおけるTender-XAFS測定による有機半導体薄膜評価

ご所属：（公財）佐賀県産業振興機構 九州シンクロトロン光研究センター

講師名：瀬戸山 寛之

講演内容：SAGA-LSでは、放射光を用いて元素選択的に化学状態や配位環境の知見を得ることができるTender X線エネルギー領域のX線吸収分光（XAFS）測定装置を整備し、S-K吸収端のTender-XAFS測定により、有機半導体薄膜デバイスであるTop contact型DNTTのTFTの連続駆動がDNTTの化学状態に与える影響についてお話しをする。また、同測定において、放射光の水平偏光特性を用いたXAFSスペクトルのX線入射角度依存性から、DNTT分子が主に基板に対してstanding配向であることを確認したことについて概説する。

参考文献

- ・ K. Yamagami, H. Yoshino, H. Yamagishi, H. Setoyama, A. Tanaka, R. Ohtani, M. Ohba, H. Wadati, “The ligand field in low-crystallinity metal–organic frameworks investigated by soft X-ray core-level absorption spectroscopy”, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 24, 16680 (2022).
- ・ F. Iesari, H. Setoyama, T. Okajima, “Extracting Local Symmetry of Mono-Atomic Systems from Extended X-ray Absorption Fine Structure Using Deep Neural Networks”, *Symmetry*, 13(6), 1070 (2021).

問い合わせ先

佐賀大学理工学部化学部門

川喜田英孝、e-mail: kawakita@cc.saga-u.ac.jp、tel: 0952-28-8670